Московский физико-технический институт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11A ПО КУРСУ ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Фотоэлектрический способ преобразования энергии солнечного излучения

выполнили студенты Б04-004 группы Семёнова Наталия Атласов Владислав Плюскова Наталия Богатова Екатерина **В работе:** Исследование темновой и световой вольтамперной характеристики фотоэлемента. Изучение влияния мощности падающего излучения на характеристики образца с помощью фильтров.

1 Теоретическое введение

Электронно-дырочный переход

Прямое преобразование лучистой энергии Солнца в электрическую осуществляется с помощью фотоэффекта на потенциальном барьере или так называемого вентильного фотоэффекта, суть которого — возникновение фото-ЭДС при освещении контактов металл-полупроводник и p-n переходов. Однако, вследствие сложной микроструктуры контактов полупроводника с металлом, мы ограничимся в дальнейшем наиболее ясным случаем p-n переходов.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой p-n переход. Пусть два полупроводника, один из которых имеет проводимость p-типа, а другой n-типа приводятся в хороший контакт по плоскости aa, как показано на изображении а (Puc. 1). Тогда под действием градиента концентрации дырки из приконтактного слоя p-области будут диффундировать в n-область, а электроны из приконтактного слоя n-области в p-область.

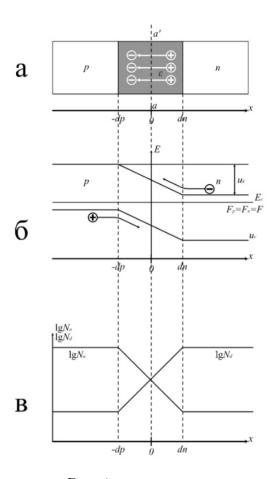


Рис. 1: р-п переход

В результате такой диффузии в приконтактном слое р-области создается отрицательный объемный заряд нескомпенсированных ионов акцепторной примеси, а в приконтактном слое n-области — положительный объемный заряд нескомпенсированных ионов донорной примеси. Порожденное объемными зарядами электрическое

поле (направление которого показано на изображении а (Рис. 1)), будет препятствовать дальнейшей диффузии основных носителей зарядов (основными называются носители, знак которых соотвествует типу проводимости полупроводника). При этом напряженность электрического поля ϵ и толщины слоев объемных зарядов в n и робластях будут возрастать до тех пор, пока не достигнут своих равновесных значений ϵ_0 , d_p и d_n , при которых диффузионные потоки основных носителей зарядов полностью скомпенсированы дрейфовыми потоками, вызванными электрическим полем объемных зарядов. Переходная область толщины $d = d_n + d_p$, объединённая свободными носителями зарядов, и в которой локализовано электрическое поле с напряженностью ϵ_0 получила название электронно-дырочного или p-n перехода. Толщина p-n-n-перехода d для различных полупроводниковых систем может изменяться от единицы и до сотых долей микрометров, а величина ϵ_0 достигать значений $\sim 10^7 B*cm^{-1}$.

Состояние p-n-перехода в термодинамическом равновесии легко понять, обращаясь к его энергетической диаграмме, приведенной на схеме б (Рис. 1). Здесь E_c дно зоны проводимости, E_{ν} – потолок валентной зоны, F – уровень Ферми. В самом деле, электроны из n-области не могут проникнуть в p-область, так как для этого им необходимо преодолеть потенциальный барьер, высота u_k которого равна контактной разности потенциалов, а энергия электронов меньше высоты этого барьера. По аналогичной причине дырки из p-области не могут попасть в n-область.

На практике p-n-переходы реализуются не механическим соединением двух полупроводников, а внутри единого кристалла, в котором создают подходящее распределение донорной N_d и акцепторной N_a примесей, например, показанной на схеме в (Рисунок 1).

2 Экспериментальная установка

Вольтамперная характеристики фотопреобразователя могут быть измерены с помощью схемы, представленной на схеме (Рис. 2). Когда преобразователь работает как генератор электроэнергии, то в качестве источника излучения используется лампа марки 3H7 или 3H8 с встроенным зеркальным отражателем и мощностью 500 Вт. Спектр ее излучения с помощью водяного фильтра приближен к спектру солнечного излучения и к спектральной чувствительности кремниевого преобразователя.

Перед началом и после измерений тумблеры на пульте управления и переключатели других приборов должны быть установлены в следующих положениях:

- Тумблер 1: подачи напряжения от батареи аккумуляторов в положении «выкл».
- Тумблер 2 переключение полярности микроамперметра М 95 в положении «обр».
- Тумблер 3 переключение с микроамперметра на миллиамперметр в положении «мА».
- Тумблер 4 изменение полярности напряжения подаваемого на фотопреобразователь в положении «обр.».

Потенциометры «грубо» и «точно» должны быть выведены против часовой стрелки до упора.

Переключатель шкалы микроамперметра М 95 должен стоять в положении «арретир», а наружный шунт к М 95 в положении « ∞ ».

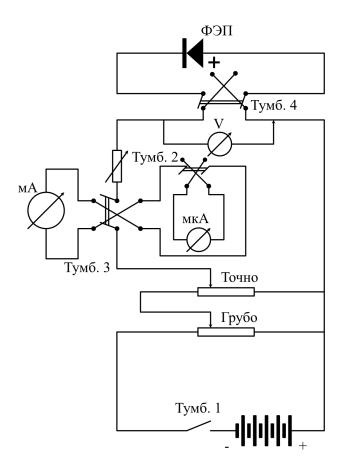


Рис. 2: Схема установки для экспериментальных исследований световой и темновой \mathbf{b}/\mathbf{a} характеристик фотоэлементов

3 Ход работы

Проведём измерение темновых вольтамперных харакстерстик исследуемого кремниевого фотоэлемента.

Начнём с прямой ветви темновой в/а характеристики. Будем снимать точки до $300~{\rm mB}$ с шагом в $20~{\rm mB}$, а затем до $700~{\rm mB}$ с шагом $50~{\rm mB}$. Предварительно не забудем учесть, что ноль напряжений смещён на 0.9 делений (на $9~{\rm mB}$) вправо.

U, мВ	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221
І, мкА	4,9	9	13	17	21	24	28	32,5	36	40	44
U, мВ	241	261	281	331	381	431	481	531	581	631	681
І, мкА	48,3	50	54	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	111,5	121	130,5

Таблица 1: Зависимость значений прямого темнового тока от напряжения на фотоэлементе

Основываясь на данных из таблицы 1 построим график зависимости тока от напряжения (вольт-амперную характеристику) — рис 3 — и фиттируем её линейной зависимость, проходящей через ноль.

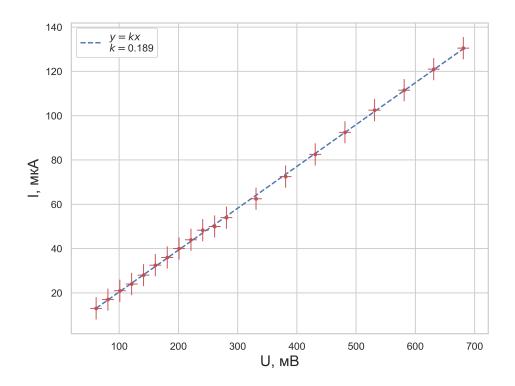


Рис. 3: Вольт-амперная характеристика темнового тока (прямая ветвь)

Здесь в качестве погрешностей использовали цену деления прибора: $10~\mathrm{mB}$ для напряжения и $5~\mathrm{mkA}$ для тока.

Теперь аналогично снимем обратную ветвь темновой в/а характеристики. Будем снимать точки с шагом в $10~\rm mB$ до значения напряжения в $100~\rm mB$. Также учтём, что напряжения сдвинуто вправо на $9~\rm mB$.

U, мВ											
І, мкА	0	2	4	6,3	8,2	10,1	12,5	14,7	17	19	20,5

Таблица 2: Зависимость значений обратного темнового тока от напряжения на фотоэлементе

Из таблицы 2 строим BAX уже для обратной ветви темнового тока – рис. 4

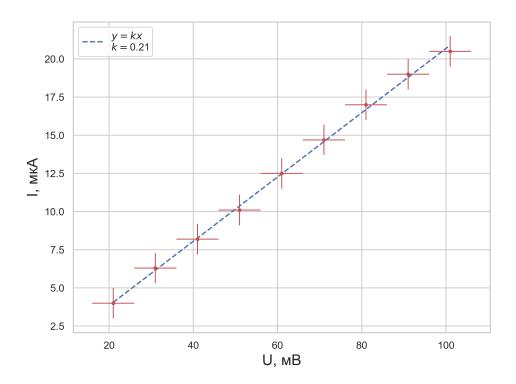


Рис. 4: Вольт-амперная характеристика темнового тока (обратная ветвь)

Здесь погрешность для напряжения -5 мB, для тока -1 мкA (цена деления для тока изменилась в случае обратной ветви).

Теперь оценим $R_{\rm m}$ и $R_{\rm n}$ как обратные угловые коэффициенты на рисунках 4 и 3 соответсвенно.

$$R_{\text{III}} = \left(\frac{dI}{dU}\right)_{\text{ofp}}^{-1}; \quad R_{\text{II}} = \left(\frac{dI}{dU}\right)_{\text{прям}}^{-1}.$$

Погрешности оценим по следующей формуле (как погрешность косвенной величины $\sigma_y = \left| \frac{dy}{dx} \right| \sigma_x$):

$$\sigma_R = \frac{\sigma_{(dI/dU)}}{\frac{dI}{dU}}.$$

Таким образом, получаем следующий результат:

$$R_{\text{III}} = (4.75 \pm 0.01) \cdot 10^3 \,\text{OM}; \quad R_{\text{II}} = (5.25 \pm 0.02) \cdot 10^3 \,\text{OM}.$$

Теперь построим график зависимости $ln(I)=f\left(U\right)$ для прямой ветви тока, чтобы найти коэффициенты A и I_s .

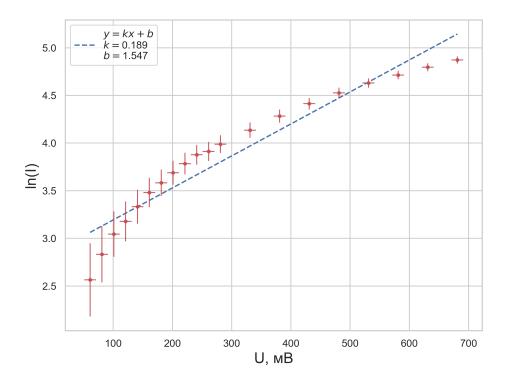


Рис. 5: График зависимости ln(I) = f(U) (для прямой ветви темнового тока)

Погрешность для ln(I) оценили по формуле для погрешности косвенного измерения:

$$\sigma_{ln(I)} = \frac{\sigma_I}{I}.$$

Коэффициенты A и I_s Найдём с помощью следующей формулы:

$$ln(I) = ln(I_s) + U \frac{e}{A \cdot kT}.$$
 (1)

Таким образом, отсюда и рис. 5 находим коэффициенты A и I_s :

$$I_s = e^b = (17 \pm 5) \,\mathrm{mkA}$$

$$A = \frac{1}{0.025 \cdot k} = (12 \pm 4)$$

4 Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы сняли вольт-амперные характеристики темнового тока для прямой и обратных ветвей для исследуемого кремниевого фотоэлемента (рис. 3, 4). С помощью этих вольт-амперных характеристик рассчитали значения для $R_{\rm m}=(4.75\pm0.01)\cdot10^3$ Ом и $R_{\rm n}=(5.25\pm0.02)\cdot10^3$ Ом. Также, с помощью графика зависимости ln(I)=f(U) (рис. 5) для прямой ветви темнового тока рассчитали коэффициенты A и I_s , фигурирующие в формуле 1: $I_s=(17\pm5)\,{\rm mkA}$, $A=(12\pm4)$.

График зависимости ln(I) = f(U) (рис. 5) получился очень не точным (плохо фиттируется линейной зависимостью). Это может быть связано с проблемами, возникшими в ходе выполнения работы. Например, у нас мог сгореть фотоэлемент, из-за чего значения, полученные нами, оказались неточными.